



MSV-5300 **Микроспектрофотометр** **200-1700 нм с InGaAs-** **детектором**

Производитель: JASCO
Corporation

Модель: MSV-5300

<https://assa-group.ru/msv-5300-mikrospektrofotometr-200-1700-nm-s-ingaas-detektorom>

Спектрофотометр MSV-5300 оснащен InGaAs-детектором с Пельтье-охлаждением и способен регистрировать спектры в диапазоне длин волн 200 - 1700 нм с точностью ± 0.3 нм.

Ключевые особенности:

- Все приборы из серии MSV-5000 оснащены автоматическими поляризаторами Глена-Тейлора.
- Установка автоматизированного XYZ-столика позволяет расширить набор анализируемых образцов
- Кроссплатформенное программное обеспечение Spectra Manager™ II существенно упрощает и ускоряет процесс получения и обработки данных

В рамках метода молекулярного анализа спектрофотометры MSV-5100 позволяют проводить измерения ширины запрещенной зоны и толщины пленок полупроводников, регистрировать спектры отражения/пропускания, а также оценивать оптические характеристики функциональных кристаллов и проводить анализ

цвета микроскопических объектов.

Отличительные особенности:

- Широкополосные объективы кассегрена обеспечивают непрерывные измерения величины отражения/пропускания во всем желаемом спектральном диапазоне.
- При использовании CMOS камеры высокого разрешения возможно применение контролируемого с помощью компьютера поворотного устройства. Данная операция позволяет осуществлять выбор одного из $\times 10$, $\times 16$ или $\times 32$ объективов в комбинации со стандартным зумом. Это, в свою очередь, значительно улучшает качество видеоизображения образца.
- Все модели включают в свой состав возможность установки ширины щели для вариации спектрального разрешения. Также предусмотрено наличие круговых и прямоугольных диафрагм для распознавания отдельных участков образца.

Оптическая система	Двухлучевая, с одним монохроматором, схема Черни-Тернера
Источник	Дейтериевая лампа 30Вт, галогенная лампа 20Вт
Источник (дополнительно)	Ксеноновая лампа 150Вт (с воздушным охлаждением)
Диапазон длин волн	200 - 1600 нм
Точность по длине волны	± 0.3 нм (656.1 нм) ± 1.5 нм (1312.2 нм)
Ширина полосы пропускания L - режим пониженного	1, 2, 5, 10, L2, L5, L10 нм (Уф/вид.)

светорассеяния	2, 4, 10, 20, L4, L10, L20 нм (БИК)
Режимы регистрации	Непрерывное сканирование, пошаговое сканирование (step scan)
Детектор	ФЭУ InGaAs с Пельтье-охлаждением
Наблюдение образца	CMOS камера высокого разрешения (1600 × 1200 пикс.), оптическое увеличение, ATOS, подсветка LED
Наблюдение образца (дополнительно)	Бинокляр, поляризованное освещение, объективные линзы
Объектив	Объектив кассегрена с ×10, ×16, ×32 увеличением (на выбор) *1
Зеркальный конденсор	Собирательное зеркало кассегрена с ×10, ×16, ×32 увеличением (сменное) *1 (Функция автоматической коррекции зеркального конденсора)
Диафрагма	Устанавливаемые пользователем значения для двух диафрагм (круглых и прямоугольных) 10, 20, 30, 50, 100, 200 μmf (×16 объектив) 5, 10, 15, 25, 50, 100 μmf (×32 объектив) 16, 32, 48, 80, 160, 320 μmf (×10 объектив)

Столик образца	Столик с ручным управлением (рабочая площадь: X 50 × Y 75 × Z 20 мм) *2
Столик образца (дополнительно)	Автоматический столик (рабочая площадь: X 76 × Y 52 × Z 25 мм, шаг 1 мкм) *2, джойстик (дополнительно)
Поляризатор	Глена-Тейлора, с автоматической вставкой/установкой угла
Анализатор (дополнительно):	Глена-Тейлора, с автоматической вставкой/установкой угла
Контрольная панель	Переключатель и индикатор касегрена, индикатор режимов отражение/пропускание, выбор диафрагмы, запуск/остановка измерений, автофокус, автоматическая коррекция зеркального конденсора, оптический зум, автоматическая подсветка образца, подсветка камеры образца ВКЛ/ВЫКЛ, подсветка ATOS (Aperture Through Optical System)
Размеры	700 (Ш) × 740 (Г) × 640 (В) мм
Вес	105 кг
Энергопотребление	150 В*А
Программное обеспечение	JASCO Spectra Manager™ II
Операционная система	Windows7 Professional

Программы (стандартно)	Микроскопические измерения (многоточечные измерения, линейное и плоскостное картирование), микроспектральный анализ, спектральный анализ (обработка данных: расчет толщины пленки, анализ цвета, поиск пиков, производные), времяразрешенные измерения, валидация, JASCO Canvas (составление отчетов), средства администрирования
Программы (дополнительно) *3	Картирование при фиксированной длине волны (линейное и плоскостное), автофокус, мультиизображение

*1. Объектив кассегрена и зеркало поставляются с одинаковым увеличением.

*2. Дистанция перемещения зеркала и увеличение объектива зависят от образца.

*3. Дополнительное программное обеспечение поставляется при установке автоматического столика.

<https://assa-group.ru/msv-5300-mikrospektrofotometr-200-1700-nm-s-ingaas-detektorom>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу**

+ 7 495 215-06-01

задачу

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.